

**NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD**

**CEI  
IEC**

**60749-3**

Première édition  
First edition  
2002-04

---

---

**Dispositifs à semiconducteurs –  
Méthodes d'essais mécaniques et climatiques –**

**Partie 3:  
Examen visuel externe**

**Semiconductor devices –  
Mechanical and climatic test methods –**

**Part 3:  
External visual examination**



Numéro de référence  
Reference number  
CEI/IEC 60749-3:2002